

Presse-Information

Datum: April 2011

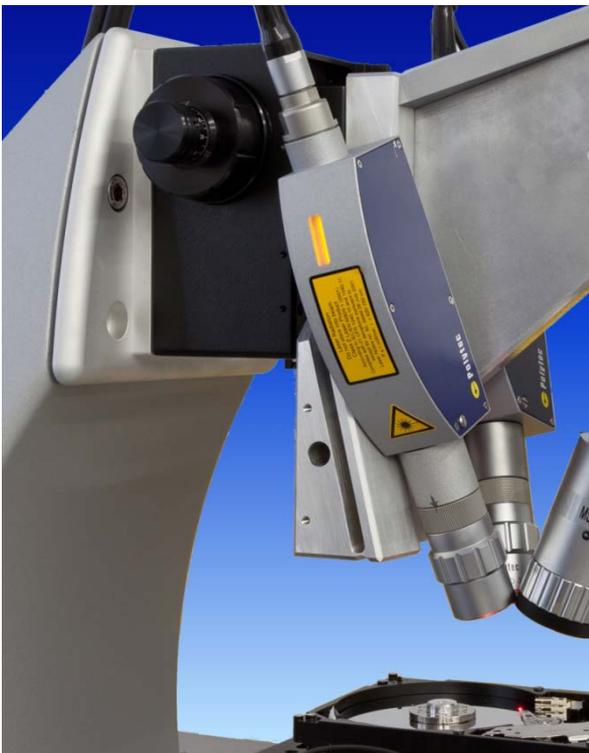
Anlage:

Kennziffer: PR-0065-HST-290311-HMI-

Polytec auf der MicroNanoTec 2011

Advancing Measurements by Light – Vorteile für Produktentwicklung und Qualitätssicherung: das generelle Leitmotiv von Polytec beschreibt treffend das auf der MicroNanoTec 2011 präsentierte Lösungsangebot des Spezialisten für berührungslose optische Messtechnik.

Als Neuheiten präsentiert Polytec auf dem IVAM-Stand das **MSA-050-3D Vibrometer** für die 3D-Schwingungsmessung an Mikrosystemen sowie die einfach und vielseitig einsetzbaren optischen Topografie-Punktsensoren der **TopSens-Linie**.



Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Frauke Kapler
Tel.: 07243/604-236

Presse-Information

Datum: April 2011

Anlage:

Kennziffer: PR-0065-HST-290311-HMI-

Ein weiteres Highlight ist das **Polytec UHF-120 Ultrahochfrequenz-Vibrometer**. Es ermöglicht durch ein innovatives Design, Bewegungen von MEMS und anderen hochfrequent schwingenden Strukturen mit Frequenzen bis 1,2 GHz und Amplituden im sub-pm-Bereich einfach und berührungslos zu messen und auch in „Slow-Motion“ zu visualisieren. Das neue Polytec Mess-System ist aufgrund seiner Frequenzbandbreite somit das perfekte Werkzeug für die Untersuchung hochfrequenter RF-MEMS und mittels der hohen lateralen Auflösung des Systems prädestiniert für die Untersuchung und dynamische Charakterisierung von Systemen mit kurzen akustischen Wellenlängen, wie beispielsweise SAWs oder BAWs.



Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Frauke Kapler
Tel.: 07243/604-236

Presse-Information

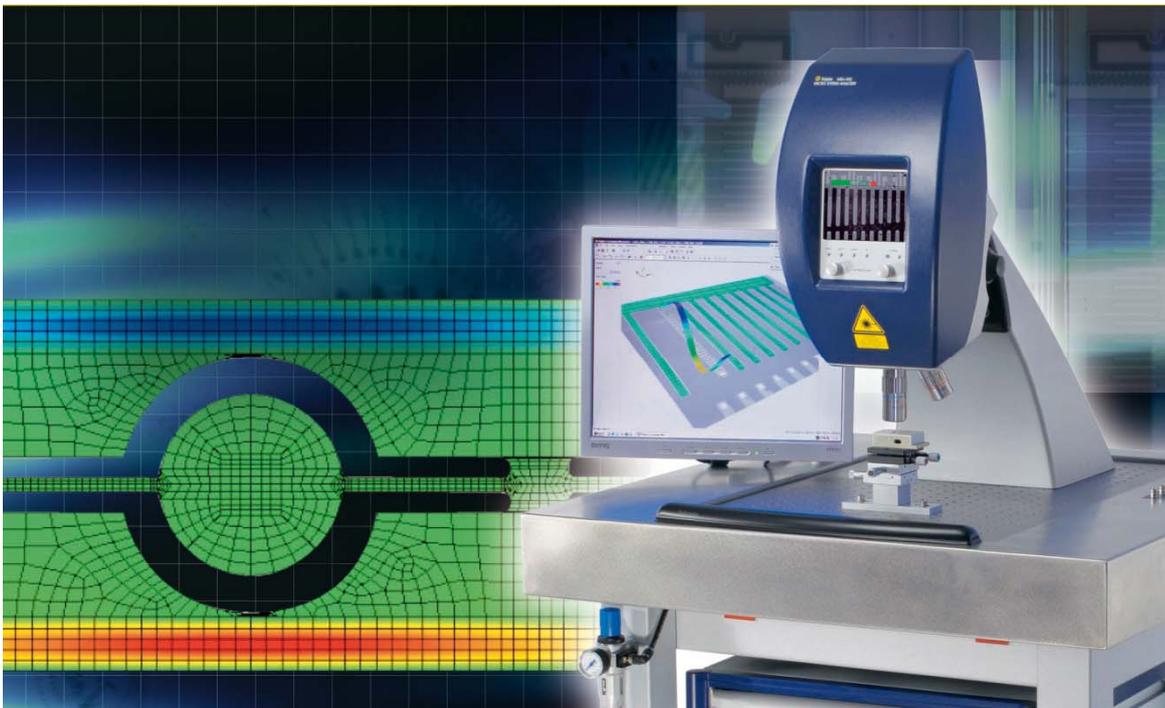
Datum: April 2011

Anlage:

Kennziffer: PR-0065-HST-290311-HMI-

Und als All-In-One Lösung zeigen wir den **MSA-500 Micro System Analyzer** als ideales Entwicklungswerkzeug für die vollständige Charakterisierung von Dynamik und Topografie von MEMS-Bausteinen.

Weitere Info: <http://www.polytec.de>



Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Frauke Kapler
Tel.: 07243/604-236